

Вахрушев Владимир Олегович

Закономерности изменений теплопроводности и оптических свойств многослойных покрытий Ag/TiAlN и Ag/Al₂O₃

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Специальность **01.04.07 – «Физика конденсированного состояния»**

Работа выполнена в Научном центре металловедения и физики материалов (НЦМФМ) ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина»

Научный руководитель: к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник научного центра металловедения и физики материалов (НЦМФМ) ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Вайнштейн Дмитрий Львович.

Научный консультант: к.т.н., начальник лаборатории физики поверхности научного центра металловедения и физики материалов (НЦМФМ) ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» Ковалев Анатолий Иванович

Экспертная комиссия:

1. Мухин Сергей Иванович - доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой теоретической физики и квантовых технологий НИТУ «МИСиС» – председатель комиссии;
2. Панина Лариса Владимировна - доктор физико-математических наук, профессор кафедры технологии материалов электроники НИТУ «МИСиС»;
3. Филатов Дмитрий Олегович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории стохастических мультстабильных систем Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»;
4. Васильевский Иван Сергеевич, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник центра радиофотоники и СВЧ-технологий института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»;
5. Ильичев Эдуард Анатольевич, доктор физико-математических наук, профессор кафедры квантовой физики и наноэлектроники Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Ведущее предприятие:

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования Российский технологический университет МИРЭА (РТУ МИРЭА), г. Москва

Защита диссертации состоится «25» февраля 2022 года по адресу 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 2.